



Gdańsk, 18.12.2012r.
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP/419/050/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „uPzp” Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonała zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie:

1) Rdz. I.

Przed zmianą: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja spektrometru rentgenowskiego do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać pełen montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz przeprowadzić szkolenie instruktażowe (dla minimum 3 pracowników Zamawiającego).

Wszystkie elementy, podzespoły mają być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

Spektrometr nabiurkowy, zasilany 230 V / 50 Hz, z pokrywą otwieraną do góry, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wykonanie pomiaru przy otwartej pokrywie;

Zakres wykrywanych pierwiastków co najmniej od glinu (13) do uranu (92)

Lampa rentgenowska typu „micro-focus” z wolframową lub inną odpowiednią anodą, oknem berylowym, chłodzona powietrzem

Regulowane napięcie w co najmniej trzech krokach: 10kV, 30kV, 50kV;

Zmienne automatycznie co najmniej cztery kolimatory o rozmiarach od: Ø0.2mm do Ø2mm; Rozmiar najmniejszej powierzchni pomiarowej nie większy niż Ø0.3mm;

Co najmniej sześć ustawień filtrów;

Ręcznie regulowana odległość pomiarowa w zakresie niemniejszym niż 0-20mm, (odległość pomiarowa kompensowana przez oprogramowanie);

Detektor: SDD z chłodzeniem Peltiera i rozdzielczością nie gorszą niż 150eV (fwhm at Mn-K α)

Podgląd mierzonej przestrzeni pomiarowej z wykorzystaniem kolorowej kamery CCD, z nicią pajęczą wskazującą wielkość realnej powierzchni pomiarowej. Zakres powiększeń nie gorszy niż: od 30x

Wielkość przestrzeni wewnątrz komory nie mniejsza niż: sz. x gł. x wys.: 300 x 200 x 80mm

Komora zaopatrzona w blokadę uniemożliwiającą wykonanie pomiaru bez jej zamknięcia.

Komputer PC, z systemem operacyjnym, monitor min. 19 cali, klawiatura, myszka

Oprogramowanie w język polskim lub angielskim, pozwalające na analizy do 24 pierwiastków jednocześnie, wykorzystujące metodę parametrów fundamentalnych

Możliwość wykonywania bez-wzorcowych pomiarów składów stopów, roztworów oraz grubości powłok (co najmniej 24 pierwiastki lub powłoki jednocześnie), na podstawie dostarczonych programów;

Wyposażenie do badania składu roztworów, proszków oraz past.

Możliwość tworzenia własnych programów pomiarowych

Możliwość samodzielnej kalibracji urządzenia z wykorzystaniem własnych wzorców

Możliwość pomiaru składu stopu przez powłokę oraz jednoczesnego badania składu i grubości powłoki na znanym podłożu.

Obliczanie dokładności analizy, wymaganego czasu pomiarowego i odległości głowicy pomiarowej od przedmiotu jako funkcja spodziewanej grubości powłoki (powłok).

Możliwość eksportu wyników pomiarów do innych systemów.

Instalacja oraz co najmniej 2-dniowe szkolenie z obsługi w cenie dostawy dla minimum 3 pracowników Zamawiającego.



Licencja na oprogramowanie będzie udzielona na warunkach wskazanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga aby udzielona licencja na dostarczane oprogramowanie obejmowała prawo do korzystania przez czas nieokreślony, oraz była nieograniczona terytorialnie. Dodatkowe wymagania zawarte są w § 5 wzoru umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ. Warunki licencji opisane przez Wykonawcę zawarte w ofercie będą załącznikiem do umowy zawartej z Wykonawcą na zrealizowanie przedmiotowej dostawy.

Warunki dostawy:

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie – załącznik nr 5 do SIWZ na minimum 7 dni przed planowaną dostawą, w przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy. W przypadku gdyby dostawa odbyła się za pośrednictwem osób trzecich np. firmy kurierskiej a instalacja i szkolenie miałyby rozpocząć się w innym terminie Zamawiający bezwzględnie wymaga aby przedmiotowe czynności odbyły się nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy. Po przekroczeniu terminów: realizacji zamówienia, instalacji lub szkolenia „Cena wskazana w umowie” zostanie pomniejszona o kary umowne, które zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego zestawu Zamawiający odmówi odbioru. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji naliczona zostanie kara umowna – szczegółowe informacje dotyczące warunków odbioru i szkolenia zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja spektrometru rentgenowskiego do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać pełen montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz przeprowadzić szkolenie instruktażowe (dla minimum 3 pracowników Zamawiającego).

Wszystkie elementy, podzespoły mają być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

Spektrometr nabiurkowy, zasilany 230 V / 50 Hz, z pokrywą otwieraną do góry, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wykonanie pomiaru przy otwartej pokrywie;

Zakres wykrywanych pierwiastków co najmniej od glinu (13) do uranu (92)

Lampa rentgenowska typu „micro-focus” z wolframową lub inną odpowiednią anodą, oknem berylowym, chłodzona powietrzem.

Regulowane napięcie płynne lub w co najmniej trzech krokach: 10kV, 30kV, 50kV,

Zmienne automatycznie co najmniej cztery kolimatory o rozmiarach od: Ø0.5mm (lub mniejsze) do Ø1,5mm (lub większe); Rozmiar najmniejszej powierzchni pomiarowej nie większy niż Ø0.3mm;

Co najmniej pięć ustawień filtrów;

Ręcznie lub automatycznie regulowana odległość pomiarowa w zakresie niemniejszym niż 0-20mm, (odległość pomiarowa kompensowana przez oprogramowanie);

Detektor: SDD z chłodzeniem Peltiera i rozdzielczością nie gorszą niż 150eV (fwhm at Mn-K α)

Podgląd mierzonej przestrzeni pomiarowej z wykorzystaniem kolorowej kamery CCD, z nicią pajęczą wskazującą wielkość realnej powierzchni pomiarowej. Zakres powiększeń nie gorszy niż: od 30x

Wielkość przestrzeni wewnątrz komory nie mniejsza niż: sz. x gł. x wys.: 300 x 200 x 80mm

Komora zaopatrzona w blokadę uniemożliwiającą wykonanie pomiaru bez jej zamknięcia.

Komputer PC, z systemem operacyjnym, monitor min. 19 cali, klawiatura, myszka

Oprogramowanie w język polskim lub angielskim, pozwalające na analizy do 24 pierwiastków jednocześnie, wykorzystujące metodę parametrów fundamentalnych

Możliwość wykonywania bez-wzorcowych pomiarów składów stopów, roztworów oraz grubości powłok (co najmniej 24 pierwiastki lub powłoki jednocześnie), na podstawie dostarczonych programów;

Wyposażenie do badania składu roztworów, proszków oraz past.

Możliwość tworzenia własnych programów pomiarowych

Możliwość samodzielnej kalibracji urządzenia z wykorzystaniem własnych wzorców



Możliwość pomiaru składu stopu przez powłokę oraz jednoczesnego badania składu i grubości powłoki na znanym podłożu.

Obliczanie dokładności analizy, wymaganego czasu pomiarowego i odległości głowicy pomiarowej od przedmiotu jako funkcja spodziewanej grubości powłoki (powłok).

Możliwość eksportu wyników pomiarów do innych systemów. Instalacja oraz co najmniej 2-dniowe szkolenie z obsługi w cenie dostawy dla minimum 3 pracowników Zamawiającego.

Licencja na oprogramowanie będzie udzielona na warunkach wskazanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga aby udzielona licencja na dostarczane oprogramowanie obejmowała prawo do korzystania przez czas nieokreślony, oraz była nieograniczona terytorialnie. Dodatkowe wymagania zawarte są w § 5 wzoru umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ. Warunki licencji opisane przez Wykonawcę zawarte w ofercie będą załącznikiem do umowy zawartej z Wykonawcą na zrealizowanie przedmiotowej dostawy.

Warunki dostawy:

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie – załącznik nr 5 do SIWZ na minimum 7 dni przed planowaną dostawą, w przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy. W przypadku gdyby dostawa odbyła się za pośrednictwem osób trzecich np. firmy kurierskiej a instalacja i szkolenie miałyby rozpocząć się w innym terminie Zamawiający bezwzględnie wymaga aby przedmiotowe czynności odbyły się nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy. Po przekroczeniu terminów: realizacji zamówienia, instalacji lub szkolenia „Cena wskazana w umowie” zostanie pomniejszona o kary umowne, które zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego zestawu Zamawiający odmówi odbioru. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji naliczona zostanie kara umowna – szczegółowe informacje dotyczące warunków odbioru i szkolenia zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2) Rdz. IX. Pkt. 22

Przed zmianą: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości
Pok. 11
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk

i opisane: „Dostawa spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”

nr postępowania ZP/419/050/D/12

Nie otwierać przed dniem 19.12.2012 godz. 12:00.

Po zmianie: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości
Pok. 11
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk



i opisane: „Dostawa spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”
nr postępowania ZP/419/050/D/12
Nie otwierać przed dniem 11.01.2013 godz. 12:00.

3) Rdz. X. Pkt 4 oraz 6.

Przed zmianą:

4. Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2012 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk, (pokój nr 11)

Po zmianie:

4. Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2013 o godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2013 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk, (pokój nr 11)

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**

KANCLERZ
mgr inż. Marek Tłok